Elektronik 2

FS 24 Guido Keel (Michael Lehmann) Autoren:

Authors

Version: 1.0.20240317

 $\underline{https://github.com/P4ntomime/elektronik-2}$

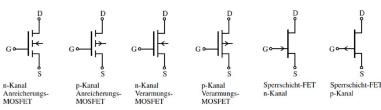


Inhaltsverzeichnis

1	Feld	effekt-Transistoren	2	3	CMOS-Logik	3
	1.1	FET-Typen und Symbole	2		3.1 Grundgatter in CMOS-Logik	
	1.2	Sperrschicht-FET / Junction FET (JFET)	2		3.2 Dualität NMOS - PMOS	
	1.3	MOS-FETs	2		3.3 Verlustleistung bei CMOS-Logik	
	1.4	Verstärkerschaltungen mit FETs	2		3.4 Verzögerungszeit	3
	1.5	MOS-FET als (Leistungs-)Schalter	2	4	Schmitt-Trigger	3
	1.6	Transmission Gate	2		4.1 Aufbau nichtinvertierender digitaler Schmitt-Trigger	
					4.2 Aufbau invertierender digitaler Schmitt-Trigger	
2	Trar	sistor-Transistor-Logik	2		4.3 Schmitt-Trigger vs. CMOS-Logik	3
	2.1	Resistor Transistor Logik (RTL)	2	5	Signalübertragung	3
	2.2	Dioden-Transistor-Logik (DTL)	3		5.1 Leitungstheorie	3
	2.3	Transistor-Transistor-Logik (TTL)	3		5.2 Einfluss / Relevanz von Refelxionen	

1 Feldeffekt-Transistoren

1.1 FET-Typen und Symbole

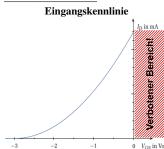


1.1.1 Anschlüsse eines FET

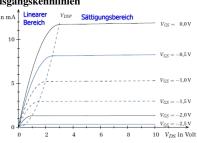
Kanal von Drain zu Source (Stromfluss), gesteuert von Gate (und Bulk)

1.2 Sperrschicht-FET / Junction FET (JFET)

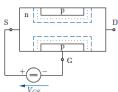
1.2.1 Kennlinien



Ausgangskennlinien



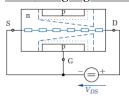
1.2.2 Linearer Bereich (gesteuerter Widerstand)



- Für kleinen Spannung-Unterschied ${\cal V}_{DS}$
- V_{GS} ändert Dicke der Raumladungszone (Kanal)
- n-Kanal JFET: Je negativer V_{GS} , desto weniger Strom fliesst bzw. desto enger der Kanal

$$I_{D} = \frac{2 \cdot I_{DSS}}{V_{p}^{2}} \left(V_{GS} - V_{p} - \frac{V_{DS}}{2} \right) V_{DS}$$

1.2.3 Sättigungs-Bereich (Stromquelle)



- Für hohes V_{DS} wird leitender Kanal abgeschürt →Strom kann nicht weiter steigen (Stromquelle)
- Übergang gest. Widerstand zu Stromquelle @ ${\cal V}_{DSP}$

$$\Rightarrow$$
 $V_{DSP} = V_{GS} - V_p (V_p = \text{Pinch-Off-Spannung})$

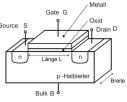
$$I_D = \frac{I_{DSS}}{V_p^2} \cdot (V_{GS} - V_p)^2$$

Verstärkungsmass Transkonduktanz:

$$g_m = \frac{2 \cdot I_{DSS}}{V_p^2} \cdot (V_{GS} - V_p) = \frac{2}{|V_p|} \cdot \sqrt{I_{DSS} \cdot I_D} \qquad [g_m] = S$$

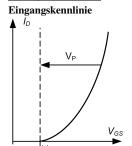
1.3 MOS-FETs

1.3.1 Aufbau

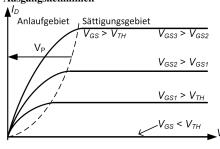


- L Länge des Transistors
- W Breite des Transistors
- · N-Kanal FET: Drain und Source sind n-dotiert
- · Kanal ist p-dotiert

1.3.2 Kennlinien



Ausgangskennlinien



1.3.3 Bereiche

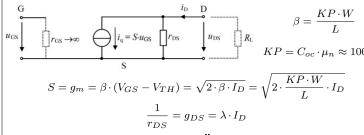
- Sperrbereich: $V_{GS} < V_{TH}$
- Linearer (Widerstands-)Bereich / Anlaufbereich: $V_{GS} > V_{TH}$
- Sättigungsbereich (Stromquelle): $V_{DS} > V_{GS} V_{TH}$

Anlaufbereich (Linearer Bereich)

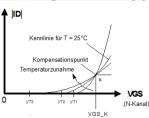
Sättigungsbereich (Stromquelle)

$$I_{D,lin} = \beta \cdot (V_{GS} - V_{TH} - \frac{V_{DS}}{2}) \cdot V_{DS} \qquad \qquad I_{D,sat} = \frac{\beta}{2} \cdot (V_{GS} - V_{TH})^2$$

1.3.4 Kleinsignal-Ersatzschaltung (MOS-FET)



1.3.5 Temperaturabhängigkeit der Übrtragungskennlinie



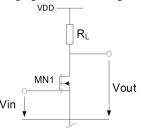
Für den n-Kanal FET gilt:

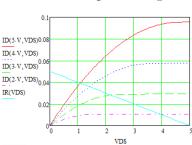
- Threshold-Spannung V_{TH} sinkt mit 1-2 $\frac{\mu V}{K}$
- β sinkt mit steigender Temperatur
- Im Kompensationspunkt bleibt I_D für fixes V_{GS}

1.4 Verstärkerschaltungen mit FETs

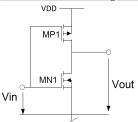
1.4.1 Source-Schaltung mit Lastwiderstand

Um den Arbeitspunkt der Schaltung zu bestimmen, wird die Lastgerade von \mathcal{R}_L in das Ausgangskennlinienfeld eingezeichnet





1.4.2 Push-Pull / Digitaler Inverter



- V_{in} geht auf NMOS und PMOS
- · Ermöglicht grössere Verstärkung

Für
$$V_{in} \approx \frac{V_{DD}}{2}$$
 gilt:

$$A_{V0} = -(g_{m1} + g_{m2}) \cdot (r_{DS1} || r_{DS2})$$

1.5 MOS-FET als (Leistungs-)Schalter

Wenn der FET als Schalter eingesetzt wird, so arbeitet er im linearen Bereich $(V_{GS} > V_{TH}, \text{d.h. } V_{out} < V_{DD} - V_{TH})$

$$I_{D,lin} = \beta \cdot (V_{GS} - V_{TH} - \frac{V_{DS}}{2}) \cdot V_{DS} \qquad r_{DS} = \frac{\mathrm{d}V_{DS}}{\mathrm{d}I_D} = \frac{1}{\beta \cdot (V_{GS} - V_{TH})}$$

$$r_{DS} = \frac{\mathrm{d}V_{DS}}{\mathrm{d}I_D} = \frac{1}{\beta \cdot (V_{GS} - V_{TH})}$$

Schalter geschlossen: $R_{FET} = R_{DS(on)}$

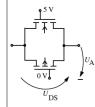
Schalter offen: $R_{FET} = \infty$

1.5.1 Verlustleistung / Erwärmung

$$P_V = R_{DS} * I_{DS}^2 = 0 \,\mathrm{W}$$

$$\Delta T = R_{th} \cdot P_V$$

1.6 Transmission Gate



Im Bild links gilt: $V_{DD}=5\,\mathrm{V},V_{SS}=0\,\mathrm{V}$

- NMOS (oben) leitet für $V_{in} < V_{DD} T_{TH,n}$
- PMOS (unten) leitet für $V_{in} > V_{SS} T_{TH,p}$
- · Source und Drain austauschbar
 - →Strom kann in beide Richtungen fliessen

Transistor-Transistor-Logik

- · Meist statischer Stromverbrauch
- Asymmetrische Schaltschwellen (weniger Marge als CMOS-Logik)

2.1 Resistor Transistor Logik (RTL)

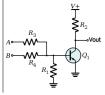


Bild: NOR-Gate

- Ausgangsspannung $V_{out} = V_{+}$ oder $V_{out} = V_{CE,sat}$
- Fan-Out ist begrenzt (Werden zu viele weitere Gatter an den Ausgang gehängt, so reicht der Strom nicht mehr, um diese zu treiben → Spannungslevel stimmen nicht mehr, um Transisoren durchzusteuern)

2.2 Dioden-Transistor-Logik (DTL)

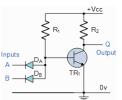
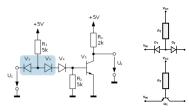


Bild: NAND-Gate

- Fan-Out grösser, da Transistor aktiv nach '0' zieht
- R_2 muss keine Gatter treiben (kein grosser Stromfluss)
- • Nachteile: Sehr tiefer Störabstand; Transistor leitet schon bei Spannungen, welche kaum $>0~{\rm V}$ sind

2.3 Transistor-Transistor-Logik (TTL)

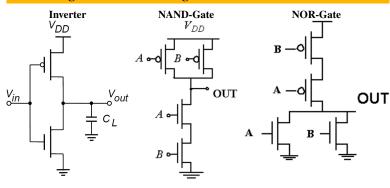


- Schaltschwelle am Eingang wird durch Dioden V_3 und V_4 um $1.4\,\mathrm{V}$ erhöht
- Dioden V₁ und V₃ bilden npn-Struktur
 ⇒npn-Transistor

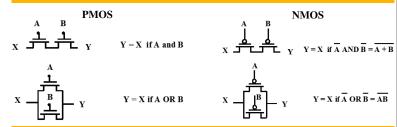
3 CMOS-Logik

- Entweder leitender Pfad nach V_{SS} (NMOS) oder V_{DD} (PMOS)
- · Kein statischer Stromverbrauch
- Langsamer als Bipolar
- Symmetrische Schaltschwellen bei ca. $\frac{V_{DD}}{2}$ (Übertrgaungskennlinie)
- Output-Level V_{ol}, V_{oh} näher bei Speisung als Input Level $V_{il}, V_{ih} \implies$ mehr Marge
- Höhere Speisespannung → weniger propagation delay
- Nicht geeignet zur Datenübertragung über längere Strecken (kein $50\,\Omega$ Abschluss)

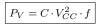
3.1 Grundgatter in CMOS-Logik



3.2 Dualität NMOS - PMOS



3.3 Verlustleistung bei CMOS-Logik



C Kapazität (aus Datenblatt)

f Frequenz

3.4 Verzögerungszeit

Linearer Bereich

$$t_{pHL} = 0.69 \cdot R_{on} \cdot C_L$$

→Exponentielle Entladung!

Sättigung (Stromquellen-Bereich)

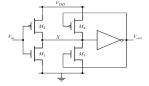
$$t_{pHL} = \frac{C_L \cdot \frac{V_{swing}}{2}}{I_{sat}} \approx \frac{C_L}{k_n \cdot V_{DD}}$$

→Lineare Entladung!

4 Schmitt-Trigger

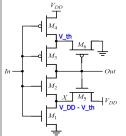
- Schaltschwellen müssen nicht sehr genau sein
- Schmitt-Trigger garantieren auch bei verrauschten Signalen saubere (einmalige) Schaltschwellen, dank der Hysterese

4.1 Aufbau nichtinvertierender digitaler Schmitt-Trigger



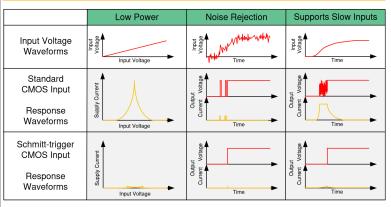
- M_1, M_2 : Digitale Inverter
- M₃, M₄: 'gesteuerte Widerstände
- Für $V_{out} = 0$: M_4 leitet, M_3 sperrt
- Für $V_{out} = 1$: M_3 leitet, M_4 sperrt
- M_3, M_4 verschieben Schaltschwellen abhängig von $V_{out} \Rightarrow$ Hysterese

4.2 Aufbau invertierender digitaler Schmitt-Trigger



- \bullet Ohne M_5, M_6 : Normaler Inverter mit je 2 Serie-Transistoren
- Für $V_{out} = 1$: Durch M_5 fliesst Strom in M_1
- V_{in} muss höher sein, um Strom der PMOS aufzunehmen
 → Höhere Schaltschwelle für High-Log-Übergang
- 'Inverses' gilt für M_6 und M_4

4.3 Schmitt-Trigger vs. CMOS-Logik



5 Signalübertragung

5.1 Leitungstheorie

- Leitungen haben Widerstände, Kapazitäten und Induktivitäten ⇒RLC-Netzwerke
- Fortpflanzungsgeschwindigkeit Signal: $v=10-20\,\mathrm{cm/ns}$ (Lichtgeschwindigkeit: $c=0\,\mathrm{cm/ns}$)
- Ev. Impedanzanpassungen zur Verhinderung von Reflexionen nötig (meistens 50Ω)
 - CMOS-Logik: tiefen Quellenwiderstand, hohen Eingangswiderstand
 Nicht geeignet zur Datenübertragung über 'längere Strecken'

5.2 Einfluss / Relevanz von Refelxionen

5.2.1 Keine Reflexionen

Wenn nichts anderes bekannt gilt: $T_r = \frac{1}{10} \cdot T$

$$T_d < \frac{1}{2} \cdot T_r$$

 $T_r = T_f$ Anstiegs- / bzw. Abfallzeit des Signals T_d Laufzeit des Signals

 T_d Laurzen des Signa. T Periodendauer

5.2.2 Reflexionen



 f_{max} Maximal enthaltene Frequenz im Signal

Länge der Leitung